

Varianten zur Bilderzeugung aus Phased Array Messdaten – Praktische Beispiele an Kupfer, CFK und anderen Materialien

Rainer BOEHM *, Daniel BRACKROCK *, Gerhard BREKOW *, Jessica KITZE *, Marc KREUTZBRUCK *

* BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin

Kurzfassung

Die Rekonstruktionsverfahren wie die Synthetic Aperture Focussing Technique (SAFT) oder die Ultraschallechotomographie (ET) nutzen eine synthetische Apertur, die dadurch entsteht, dass Echosignale von räumlich auseinanderliegenden Messpunkten überlagert werden. Dazu braucht es Sensoren mit möglichst großem Öffnungswinkel. Ein einzelner Schwinger müsste dazu vergleichsweise klein sein mit dem Nachteil sehr geringer Empfindlichkeit. Ein Phased Array (PA) realisiert den gesamten Öffnungswinkel in der Art eines Sektorscans im Schwenkwinkelbereich des Prüfkopfes und hat eine mit üblichen Prüfköpfen vergleichbare Empfindlichkeit.

An jedem Messpunkt wird das Schallbündel in Schritten, die nicht größer sind als der Öffnungswinkel des ganzen Arrays, schrittweise durch den ganzen Winkelbereich geschwenkt. Die sich daraus ergebene zusätzliche Richtungsinformation verbessert die erreichte Auflösung vor allem bei einer geringen Anzahl von Messpunkten bzw. bei größeren Messpunktabständen.

der SAFT-Rekonstruktion werden HF-Signale Bei überlagert. Für die Echotomographie wird im Prinzip der gleiche Algorithmus verwendet, jedoch unter Verwendung der gleichgerichteten Signale. Das erste Beispiel zeigt SAFT-Bilder von Testreflektoren in dickwandigen elektronenstrahlgeschweißten Kupferbehältern zur Endlagerung von hochradioaktivem Abfall. Die Echohöhe einer im Schweißnahtbereich liegenden Querbohrung (QB) mit 0.4 mm Durchmesser ist vergleichbar mit den speckleartigen Signalen aus dem Schweißnahtgefüge, wobei die QB im A- und TD-Bild nicht auffindbar ist, wohl aber im SAFT-Bild.

Im zweiten Beispiel wird eine spezielle Variante der ET zur Prüfung von CFK-Platten verwendet, die wir Fokusfeldmethode nennen. Der zweidimensionale Scan mit dem Matrixarray wird dabei an jedem Messpunkt so aufgeführt, dass in einer Ebene in definierter Tiefe ein Feld von Fokuspunkten in Schachbrettform entsteht. Die Überlagerung der Signale aus einer synthetischen Apertur führt zu einer relativen Absenkung der Anzeigen aus der Struktur des Materials gegenüber den Anzeigen von Defekten.







































































